**Халецкий Роман Александрович. Изменение электрофизических свойств системы кремний-подзатворный окисел МОП-транзисторов с поликремниевым затвором при воздействии ионизирующего излучения : диссертация ... кандидата технических наук : 05.13.05.- Санкт-Петербург, 2006.- 126 с.: ил. РГБ ОД, 61 06-5/2683**